

2008

OBIECTIVE

- Prepararea microsfereelor silicatice aparținând sistemelor Si-Bi-Gd-O, Si-Al-Gd-O, Si-Ge-Gd-O
- Analiza termică a pulberilor și microsfereelor preparate
- Caracterizarea structurală a pulberilor și microsfereelor preparate
- Analiza pulberilor și microsfereelor prin microscopie electronică de baleaj, microspectroscopie Raman și AFM
- Valorificarea rezultatelor, diseminare

ACTIVITATI

- Prepararea xerogelurilor necristaline aparținând sistemelor de studiat
- Preparare probelor vitroase aparținând sistemelor propuse pentru studiu
- Sfericizarea pulberilor necristaline
- Masuratori DTA
- Masuratori TG
- Masuratori DSC
- Masuratori DTA
- Masuratori TG
- Masuratori DSC
- Analiza probelor prin microscopie electronică de baleia
- Microspectroscopie Raman pe probele studiatej

- Studii AFM asupra probelor de studiat
- Elaborarea modelelor cu privire la dezvoltarea fazelor nanocristaline primare la suprafata microsferele silicatice
- Pregatirea rezultatelor pentru publicare si prezentare la conferinte stiintifice
- Finalizarea a doua teze de doctorat

Grad de realizare 100%